

www.souz-pribor.ru

☎ 8-800-250-72-35

✉ info@souz-pribor.ru

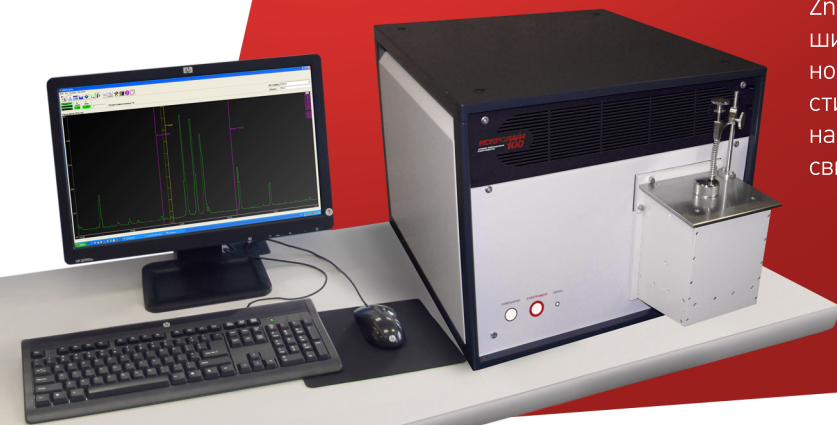
Последняя разработка компании «Промоптроэлектроника» — серия искровых эмиссионных спектрометров **ИСКРОЛАЙН**. Все приборы этой серии внесены в Государственный реестр средств измерений **Российской Федерации под № 47954-11**. Спектрометры **ИСКРОЛАЙН** обладают наилучшим в своем классе соотношением **“цена/аналитические возможности”** при высоком качестве изготовления и надежности.

ИСКРОЛАЙН

**АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ
СПЕКТРОМЕТР**

100

ИСКРОЛАЙН 100 - небольшой настольный спектрометр, предназначенный для проведения быстрого и точного анализа металлов и сплавов с различными основами (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Ti, Co, Mg и др). Прибор позволяет решать большинство аналитических задач в металлургической, литейной, машиностроительной и других отраслях промышленности, а именно: анализ различных сталей и чугунов (включая на фосфор, серу и углерод), алюминиевых и медных сплавов, свинцовых, цинковых и других цветных сплавов и металлов.



ООО “Промоптроэлектроника” создана с целью разработки, производства, продажи и обслуживания различных оптоэлектронных приборов, в частности, оптических эмиссионных спектрометров с различными источниками возбуждения спектров (искровых, дуговых, ВЧ, СВЧ и лазерных).

В компании работают инженеры и научные сотрудники очень высокой квалификации, которые последнее десятилетие успешно работали в таких областях, как оптическое и спектральное приборостроение, импульсная, силовая и микроэлектроника, программирование, конструирование. Наша команда специалистов осуществила разработку и производство ряда эмиссионных спектрометров, хорошо известных сейчас на рынке.

Главная цель нашей компании – производство и продвижение собственных приборов. Все блоки (источники возбуждения спектров, спектрографы, системы регистрации, системы управления и программно-аналитическое обеспечение) разработаны и производятся сотрудниками компании. В наших новых приборах воплощен накопленный опыт изготовления и эксплуатации других приборов, созданных в прошлом, внесены усовершенствования, повышена надежность. Наши спектрометры обладают высокими техническими и метрологическими характеристиками, просты, удобны и надежны в работе.

Объединив в себе все стадии производства приборов, от разработки до сервиса, наша компания предлагает рынку высококачественный продукт по конкурентной цене.

Технические характеристики спектрометра ИСКРОЛАЙН 100

Система возбуждения спектра	
Тип разряда	низковольтная униполярная искра в атмосфере аргона
Диапазон напряжений, В	100 – 500
Диапазон частот, Гц	100 – 400
Диапазон емкостей, мкФ	2 – 4
Диапазон индуктивностей, мкГн	40 – 750
Диапазон сопротивлений, Ом	0,3 – 3,3
Спектрограф	
Рабочий спектральный диапазон, нм	174 – 441
Спектральное разрешение, нм	0.02-0.03
Средняя обратная дисперсия не более, нм/мм	1,44
Система регистрации	
Тип фотоприемников	линейные ПЗС-детекторы
Количество фотоприемников, шт:	7
Режим передачи спектров	
Последовательный (каждый спектр от каждого кадра)	есть
Средний по всем кадрам спектр	есть
Электропитание	
Сеть	(220 ⁺²² ₋₃₃) В, (50±2) Гц
Потребляемая мощность	
Без искры, не более, ВА	500
При горении искры, не более, ВА	900
Время установления рабочего режима, не более, мин	20
Масса и габариты	
Длина × ширина × высота, не более, мм	550 × 740 × 470
Масса, не более, кг	60
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры, °С	15 ÷ 35
Диапазон атмосферного давления, кПа	84,0 ÷ 106,7
Диапазон относительной влажности, % при t = 25 °С	20 ÷ 80

Метрологические характеристики спектрометра ИСКРОЛАЙН 100

Характеристика	Значение
Диапазон измерений массовых долей элементов, %	0,0001 – 99,90
Относительная случайная погрешность (в зависимости от элемента, значения массовой доли и качества ГСО), %	менее 0.5 – 40
Пределы обнаружения, в % *	
S	0,00006
P	0,00002
C	0,00006
Si	0,00007
Cu	0,0001
Mg	0,0001
Ti	0,00006
W	0,0001
Nb	0,00006
Ni	0,0001
Cr	0,000005
Al	0,0003
Mo	0,0002
V	0,00004
Pb	0,0007
Sb	0,000008
Ag	0,00004
As	0,00001
Mn	0,00006

* Пределы обнаружения рассчитаны по критерию «3σ» для основ Fe, Cu, Al и получены на реальных методиках в типичных условиях анализа.